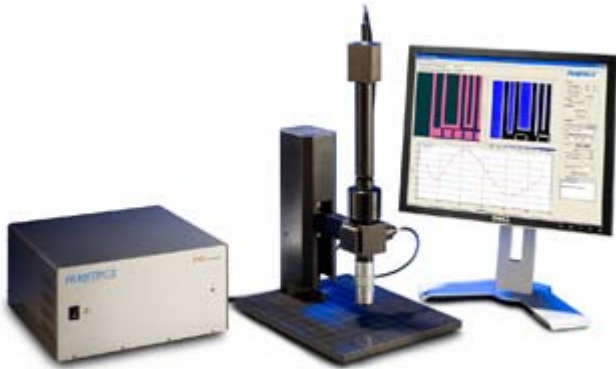


## F42 OSP 膜厚度測儀(可透光膜厚度測儀)



[請來電詢價](#)

### 產品簡介:

F42 運用光學原理來測量 OSP 膜厚度(或透光膜厚度)，提供快速非破壞的檢測，省去之前必須破壞產品且長時間才可以知道結果，F42 能在產品鍍膜完成後即時量測產品厚度，對於客戶的厚度管控能更有效率。檢測可在 OSP 鍍層的生命周期的不同階段進行，使用戶可以通過監控 OSP 鍍層形成和儲藏過程中產生的不良變化對工藝進行必要的調整。例如，可以在 PCB/PWB 生命周期的不同階段檢測 OSP 鍍層的厚度以預測在後續的工藝過程中由於 OSP 鍍層的可焊性變化而對工藝產生的影響。

### 適用行業:

PCB 印刷電路板，OSP 電鍍廠。(測 OSP 膜厚)

LCD 面板及 OLED 廠。(測可透光膜厚)

半導體製造廠。(測可透光膜厚)

### 產品特色:

- 無損檢測
- In-situ
- 超小檢測點
- 二維圖像分析功能
- FP 分析方法
- Z 軸機械可調
- 自動對焦
- 動態數據傳輸